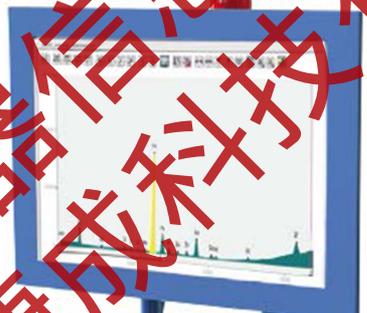


Apollo

环境空气颗粒物元素分析



仅限仪器信息网样本资料上传使用

环境空气颗粒物滤膜检测

分析方法快速，无损

超高功率 EDXRF
60kV , 400W

配备 8 滤光片及 8 二次靶

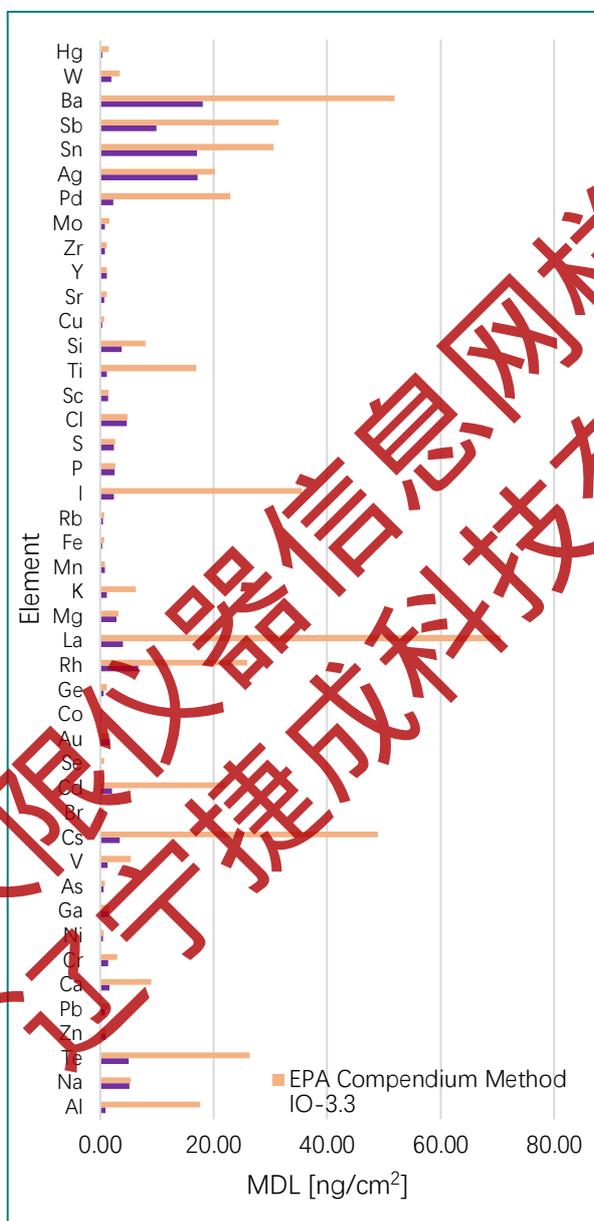
HJ 829-2017 标准
US EPA IO-3.3 标准

Apollo

环境空气颗粒物元素分析 EDXRF

该设备用于测试空气污染中大气颗粒所含元素种类，同时满足 US-EPA 相关空气质量监管要求，检出限优于 IO-3.3 相关要求值。可对大气颗粒中所含有的 60 种元素进行定性及定量分析。Apollo 提供快速、准确的测量结果，简单易用，并具备极低的检测限。Apollo 能够无损分析空气滤膜，并对滤膜样品进行定性定量分析。采用高功率二次靶技术的 Apollo 通过设置不同的电压及电流激发二次靶，以提供单色的激发光源，增加信噪比，达到极佳的检测限及灵敏度。

- 专业分析大气颗粒滤膜样品。
- 分析测试空气污染物，符合 US-EPA 相关空气质量监管要求。
- 对于滤膜样品可从 Na(12) – U(92)元素范围无损分析。
- 配备 8 个滤光片及 8 个二次靶。



配备 8 滤光片 8 二次靶的 Apollo 系统能够应用于多种领域，并表现出针对 IO-3.3 标准中 44 中元素的优秀检测能力。

Apollo 的激发功率可达 400W，通过滤光片及二次靶的切换，可轻松测量样品中的各种轻元素及重元素。其探测限优于美国 EPA 标准中规定的限值，尤其对于 Na、Al 等轻元素的探测，更是表现出其优秀的检测能力。



Apollo 技术参数

探测器	Be 窗口硅漂移探测器 (SDD) , 分辨率可达 125eV
激发源	400W , 60kV , Rh 靶 X 光管
元素分析范围	Na(12) – U(92)
检测浓度范围	亚 ppm – 100%
激发类型	直接滤光片及二次靶技术
自动进样	支持 8-10 个 31-45mm 样品位, 或客户指定尺寸
重量	110kg
测量腔室尺寸	直径 28cm , 高度 H=6cm
自定义滤光片	8 种, 可通过软件切换
自定义二次靶	8 种, 可通过软件切换
自定义准直器	0.3mm-3mm
工作介质环境	空气/氦气/真空, 并配备相关接口及流量检测元件
供电	115V AC/60Hz 或 230V AC/50Hz
计算机系统	内置集成计算机系统
操作软件	Analytix 专用软件 (Windows 操作系统)
可选软件	高级基本参数分析软件、无标样分析软件、元素库软件
备选件	样品自旋功能

Xenometrix
The Power to Change Energy Into Information

星迈中国服务中心/捷成科技有限公司

地址：辽宁省沈阳市沈河区南二经街 88 号

联系电话：024-22833025 22823025

传 真：024-22848384

电子邮箱：

enwei_zhang@jassontech.com; chelsea@jassontech.com

官方网站：http://www.jassontech.com

